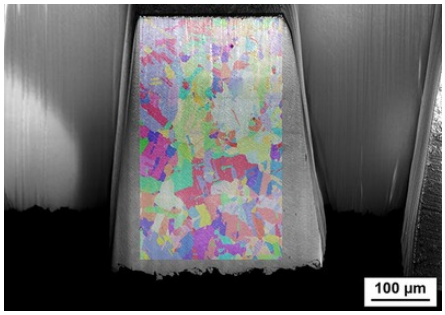
NEWS



Ankündigung Webinar "rapid and large-scale sample preparation for EBSD using the ZEISS LaserFIB"

ZEISS Microscopy und das Institut für Materialforschung veranstalten am 13. Mai 2020 ein gemeinsames Webinar zur Anwendung eines neuen Femtosekunden Lasers (fs-Laser) in Kombination mit einem ZEISS Focus Ion Beam-Systems (FIB) in der Materialforschung.

Tim Schubert vom Institut für Materialforschung und Dr. Tobias Volkenandt von ZEISS präsentieren, welche Präparationsqualität mit dem fs-Laser bei Metallen erreicht wird und wie dieser in die mikroskopischen Abläufe integriert ist. Sie stellen unter anderem Anwendungsfälle zur schnellen und zielführenden Einbindung des fs-Lasers bei elektronenmikroskopischen Mikrostrukturanalysen mit electron backscatter diffraction - kurz EBSD - vor.

Interessierte können sich zum Webinar mit dem Titel „rapid and large-scale sample preparation for EBSD using the ZEISS LaserFIB" am 13.05.2020 um 10:00 Uhr unter folgendem Link kostenfrei anmelden und teilnehmen:

https://www.zeiss.ly/1rm5